

SiC半導体評価装置 「SemiScope」

【株式会社 フォトンデザイン】

【特徴】

- ・SiCウェハの結晶欠陥を可視化できるSiC半導体評価装置
- ・世界で初めてPL(フォトルミネッセンス)イメージング法を用いており、非破壊検査が可能
- ・PLを画像として測定する事で短時間の測定が可能(6インチ、2.5時間)

【効果】

- ・省エネ効果の高いSiCパワー半導体の品質向上とコストダウンに貢献
- ・SiCが普及すればパワー半導体の省エネ効果で電力節減が可能

【パワー半導体の用途】

※パワー半導体とは、電力変換をする半導体

パワー半導体にシリコンカーバイドを応用した事例

①車両用電源



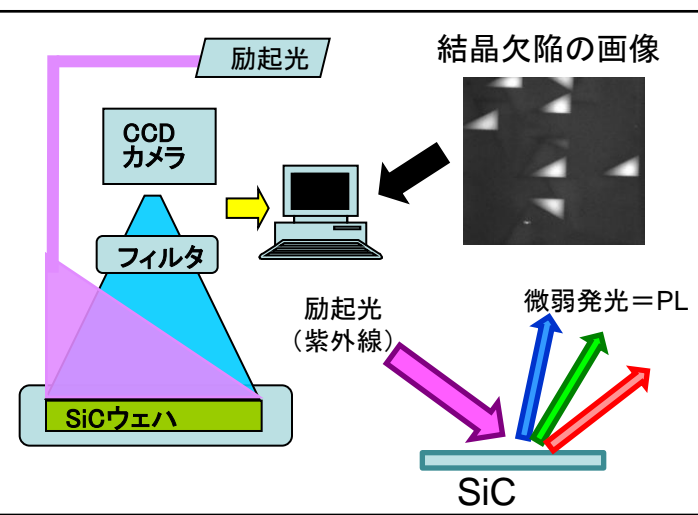
2013年3月26日三菱電機株式会社ニュースリリースより引用

②家庭用エアコン

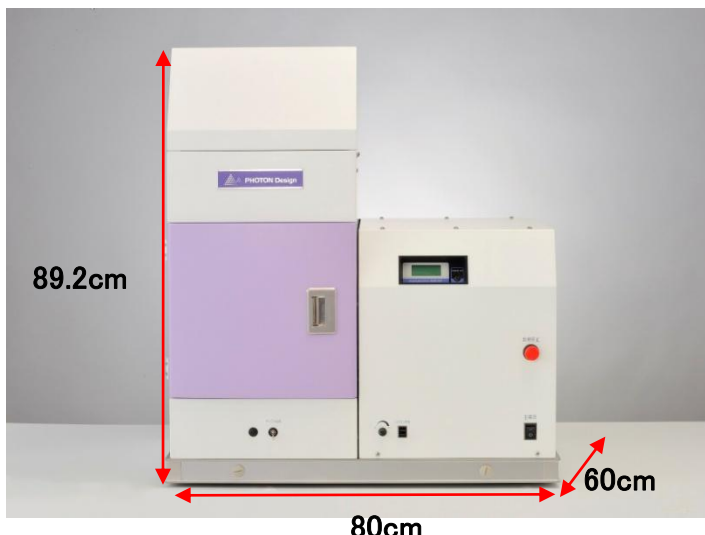


インバータ→SiCインバータにすることで変換損失を60%低減

【PLイメージングの原理】



【製品外観】



【主な納入先】

京都大学、産業技術総合研究所、SiCウェハメーカ、SiCデバイスメーカ等

PHOTON Design
株式会社 **フォトンデザイン**

株式会社フォトンデザイン
〒115-0043 東京都北区神谷2-17-1
TEL:03-5249-5705 Fax:03-5249-5706 URL:<http://www.photondesign.co.jp/>